



IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ)
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程
IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 www.iecq.org

認証書 独立試験所

IECQ 証明書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-01 発行番号: 3 認証状況: 継続中

追加の認証サイト: IECQ-L JQAJP 13.0002 初回発行日: 2009/12/18

旧認証書番号: IECQ-L JQAJP13.0002-01 発行日: 2014/12/24 サイト追加日: 2013/04/01
Issue2

CB 管理番号: JQAQ0001-002-T 有効期限: 2017/12/23

沖エンジニアリング株式会社 本庄ブランチ
〒367-8686 埼玉県本庄市小島南 4-1-1

当該組織、設備及びその手順は、IECQ電子部品品質認証制度において、基本規則IECQ01、施行規則IECQ03-1「全IECQスキームの一般要求事項」、IECQ03-6「独立試験所審査プログラム要求事項」、及びISO/IEC17025:2005のIECQ制度における電子部品試験に適用される項目について審査の結果、独立試験所に要求される該当項目に適合することを確認しました。

認証範囲:

添付 附属書

詳細は添付 附属書参照

発行認証機関: 一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒157-1873
東京都世田谷区砧一丁目 21 番 25 号

部門長: 近藤 繁幸



JQA

後援会員団体

この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。

JISC
Japanese Industrial Standards Committee

www.iecq.org



附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-01

CB 管理番号: JQAQ0002-002-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-01-SJ

改訂番号: 3

改訂日: 2014/12/24

ページ 1/2

試験対象部品

固定コンデンサ、固定抵抗器、ポテンショメータ、バリスタ、サーミスタ、コネクタ、リレー、スイッチ、プリント配線板、半導体デバイス、半導体集積回路、光部品

環境試験

IEC 60068-2-1:2007	低温（耐寒性）試験
IEC 60068-2-2:2007	高温（耐熱性）試験
IEC 60068-2-11:1981	塩水噴霧試験
IEC 60068-2-14:2009	温度変化試験
IEC 60068-2-18:2000	耐水性試験及び指針
IEC 60068-2-30:2005	温湿度サイクル試験 (12+12 時間サイクル)
IEC 60068-2-38:2009	温湿度組合せ（サイクル）試験
JIS C 60068-2-42:1993	接点及び接続部の二酸化硫黄試験
JIS C 60068-2-43:1993	接点及び接続部の硫化水素試験
IEC 60068-2-52:1996	塩水噴霧（サイクル）試験
IEC 60068-2-53:2010	耐候性（温度・湿度）と動的(振動・衝撃)と複合試験及び指針
IEC 60068-2-60:1995	混合ガス流腐食試験
IEC 60068-2-66:1994	高温高湿、定常（不飽和加圧水蒸気）試験
IEC 60068-2-68:1998	砂塵試験
JIS C 60068-2-78:2004	高温高湿（定常）試験方法
JIS D 0205:1987	自動車部品及び耐候性試験方法
JASO D 014-4:2014	自動車部品一電気・電子機器の環境条件及び機能確認試験 －第4部：気候負荷
ISO 20653:2013	路上走行車－保護の度合い(IP コード) －異物、水及び接触に対する電気機器の保護

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQの公式ウェブサイトを確認できます。 www.iecq.org



一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒157-8573 東京都世田谷区砧一丁目 21 番 25 号



附属書

独立試験所 認証書の範囲の詳細

IECQ 認証書番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-01

CB 管理番号: JQAQ0002-002-T

別添番号: IECQ-L JQAJP 13.0002-01-SJ

改訂番号: 3

改訂日: 2014/12/24

ページ 2 / 2

MIL STD 202G:2002
MIL STD 883J:2014

電子・電気部品試験方法
マイクロサーキット試験方法

機械的試験

IEC 60068-2-6:2007
IEC 60068-2-27:2008
IEC 60068-2-31:2008

正弦波振動試験
衝撃試験
落下試験及び転倒試験

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。
この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。
この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。
この認証の認証状況及びその真偽については、IECQの公式ウェブサイトを確認できます。 www.iecq.org

JQA

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒157-8573 東京都世田谷区砧一丁目 21 番 25 号